# ポリエチレンオキシドの 2次結晶化で生成した結晶の融解挙動

小薮 尚紀, 榊原 亮, 八尾 晴彦, 猿山 靖夫

### 京都工芸繊維大学 高分子機能工学専攻

(受取日:2015年12月11日,受理日:2015年12月19日)

## Melting of the Crystals Produced in the Secondary Crystallization of Poly(ethylene oxide)

Naoki Koyabu, Ryo Sakakibara, Haruhiko Yao, and Yasuo Saruyama

#### Macromolecualr Science and Engineering, Kyoto Institute of Technology

(Received Dec. 11, 2015; Accepted Dec. 19, 2015)

It is known that crystallization of polymers occurs in two steps. Firstly spherulites composed of thick lamellar crystals grow and secondly thermally less stable crystals appear in the amorphous region surrounding the thick lamella crystals. The first and second steps are called primary and secondary crystallization, respectively. In this study attention was paid to the secondary crystallization process and melting of the less stable crystals. The heat capacity and the small and wide angle X-ray scattering have been measured simultaneously. It was found that the crystals generated in the secondary crystallization took long time to complete melting.

Keywords: secondary crystallization, melting, simultaneous measurement, ac calorimetry, X-ray diffraction.



小薮 尚紀 Naoki Koyabu



八尾 晴彦 Haruhiko Yao E-mail: hyao@kit.ac.jp



榊原 亮 Ryo Sakakibara

猿山 靖夫 Yasuo Saruyama E-mail: saruyama@kit.ac.jp

#### 1. はじめに

高分子は分子間の絡み合いのために構造変化が遅く,結 晶化においても,速度論的な理由で,厚さ10nm程度の板 状結晶が,間にアモルファスを挟みながら積み重なった構 造を形成する。高分子の結晶化は,このような積層構造か ら成る球晶が試料全体を埋める一次結晶化(primary crystallization)と,比較的厚いアモルファス層の中にさら に結晶が生成する二次結晶化(secondary crystallization)の 2段階で起こることが知られている。<sup>1)</sup>二次結晶化で生成 する結晶は一次結晶化物よりも熱的に不安定であり,融点 が低い。以下では一次結晶化で生成した結晶をp結晶,二 次結晶化で生成した結晶をs結晶と呼ぶ。s結晶の融点は p結晶よりも低いため,s結晶の融解はp結晶に挟まれた 拘束条件下での融解になる。本研究では熱容量とX線回 折の同時測定によって,s結晶の形成と融解挙動を調べた。

#### 2. 実 験

試料には poly(ethylene oxide) (PEO) (Aldrich Chemical Co.,分子量 2×10<sup>5</sup>) を用いた。粉末試料を真空中 100 ℃で 溶融プレスし,厚さ約 0.2 mm のフィルムを作成した。フィルムから 5 mm×10 mm の切片を切り出し,両面にアルミニウムフィルム(厚さ 11  $\mu$ m)を真空中,100 ℃,5 時間の条件で融着した。このアルミニウムフィルムは,温度 変調用ヒーターとして用いた。融着後に炉から試料を取り出し,素早く-10℃に冷却した 2 枚のアルミニウム板で挟み,急冷して測定試料とした。

X 線回折はシンクロトロン放射光施設 SPring8 の BL40B2 ビームラインで行い,小角散乱 (SAXS) と広角 回折 (WAXD)を同時に測定した。SAXS からは板状結晶 とアモルファスの厚さの和の平均値である長周期, WAXD からは分子軸に垂直な方向のパッキングを反映した 120

© 2016 The Japan Society of Calorimetry and Thermal Analysis

反射の積分強度を求めた。X線の波長は0.1 nm, カメラ距離は2.2 m (SAXS) および0.11 m (WAXD), 露光時間はSAXSは1s, WAXDは2sとした。熱容量はacカロリメトリー法で測定した。温度変調の振幅は0.4 K, 周期は10sとした。X線の露光を20s間隔とし, 露光は温度変調が同じ位相のとき, 即ち同じ温度のときに行うようにした。

測定の温度プロフィールは次の通りである。急冷試料を, 室温からアニール温度である 55 ℃まで 5 K min<sup>-1</sup> で 昇温し,擬等温条件で 300 分間アニールを行った後に, 4 K min<sup>-1</sup>で 40 ℃まで冷却して二次結晶化を誘発し,直ぐ に 5 K min<sup>-1</sup>で昇温して冷却前と同じ擬等温条件に戻した。 Fig.1 に示差走査熱量計 (DSC)の測定結果と,アニール 温度を示す。アニールは融解ピークの初期段階で行ってい る。

#### 3. 結果と考察

Fig.2 にアニール中の温度,熱容量,長周期,120 反射 の積分強度の,アニール時間依存性を示す。(a)~(d)はア ニールの全時間範囲,(e)~(h)は200分から450分の拡大 図である。(b),(d),(f),(h)は,アニール開始時刻の値でスケ ールしている。(e)の2本の破線は,200分から300分,お よび330分から450分の結果に,それぞれフィッティング した直線である。冷却・昇温の前後の温度差は0.06 K で あり,十分に小さかったと言える。(b),(c),(d)の200分か ら300分および400分から450分のデータに,(b)は2次 曲線,(c),(d)は直線をフィッティングして,それらを(b),(c), (d)から差し引いた結果を,それぞれ(f),(g),(h)に示す。こ れらの図から,熱容量,長周期,積分強度は,全て300分 までの曲線と400分以後の曲線が滑らかにつながり,冷却・昇温の影響は,長くても100分程度の時間に限られていたことが分かる。即ち,冷却・昇温は,二次結晶化による構造の生成と消滅以外の,p結晶の構造等には,大きな影響は与えなかったと言える。以下では,先ず冷却・昇温の影響を除いた全体的な特徴について検討し,その後に冷却・昇温の影響について考察する。

Fig.2(b)の熱容量はアニール開始から 300 分まで, 顕著 に減少している。アニールに伴う熱容量の減少は, 温度変 調示差走査熱量計(TM-DSC)による測定でも観測されて いる。<sup>2)</sup>TM-DSCの結果では, 54.5 ℃, 6 時間のアニール で約 30 %減少しており, 今回の測定とほぼ一致している。 (c)の長周期はアニーリング開始後約 100分間は顕著に増 加しているが, その後は冷却・昇温の時間を除いて, ほぼ 一定と見なせる。一方, (d)の積分強度は, 150分付近で最 大となった後, 測定の最終時刻までに約 2.5 %減少してい る。

今回のアニール温度は、融解ピークのごく初期に当たる ため、p 結晶の融解あるいは融解再結晶の影響は小さい。 次の現象が主たるアニール効果であると考えられる。(1) s結晶のうちアニール温度以下の融点を持ったものの融解。 (2)結晶の厚化による結晶化度の増加。(3)結晶の秩序 化。ただし、本研究では温度変調を含む擬等温条件でアニ ールをしているため、(1)のアニール温度には温度変調振 幅程度の不明瞭さがある。しかしながら、ここでの考察で は、「アニール条件で決まるある温度以下の融点をもった 結晶が融解する」ということが満たされていればよいので、 以下ではこの効果は無視する。



**Fig.2** The temperature (*T*), the heat capacity ( $C_p$ ), the long period ( $d_{ac}$ ) and the integrated intensity (*I*) of 120 reflection of semi-crystalline poly(ethylene oxide) plotted against the annealing time. (a) to (d) show the whole time range of the annealing and (e) to (h) are extension of the time range from 200 min to 450 min.

長周期は積層方向の単位長さあたりの結晶層の数に 反比例するから、これに大きな影響を与えるのは(1) の s 結晶の融解であり、長周期の増加はアニール中の s 結晶の融解によると解釈できる。アニール温度までの昇 温過程で, s 結晶の融解が追いつかず, 残っていた s 結 晶がアニール初期に融解したと考えられる。アニール温 度に達した時刻以後の長周期の緩和時間は約15分であ った。一方, Fig.2(b)の熱容量の減少は,緩和時間約 10 分と約150分の2成分でよく表される。速い成分の緩和 時間は長周期の緩和時間に近く,熱容量の緩和も s 結晶 の融解に起因すると考えられる。ac カロリメトリーでは, s 結晶の融解熱が見かけの熱容量として観測されたため, 融解過程が熱容量減少として観測されたと理解できる。 積分強度は結晶化度を反映する。結晶化度は, s 結晶の 融解では減少するが、(2)の結晶の厚化では増加する。 Fig.2(d)の積分強度の増加は、結晶の厚化による結晶量 の増加の方がs結晶の融解による減少を上回っていたこ とを示している。結晶の厚化が長周期に影響しないのは, 厚化分だけアモルファス層が減少したためである。その 場合でも結晶とアモルファスの密度差による長周期に 変化は存在するはずであるが、それはs結晶の融解の効 果よりも十分に小さい。

アニール時間 150 分以上の領域では,熱容量減少の遅 い成分が見えている。この減少は(3)の秩序化による ものと考えられる。一方,積分強度の減少は,s結晶の 融解は 150 分までにほぼ終了していること,(2)(3)は 共に積分強度を増加させることから,(1)(2)(3)では 説明できない。PEO 結晶中の分子はらせん型であるが, 分子間相互作用のために一様らせんからは大きく外れ ている。<sup>3)</sup>また,その形態は温度によって変化すること が明らかになっている。<sup>4)</sup>このPEO 特有の性質により, 積分強度の変化は,秩序化によって分子間相互作用の様 子が変わり,分子形態が変化したことが原因である可能 性が考えられるが,本研究のデータでは判断は難しい。 長周期がほぼ一定であることは,(2)(3)は長周期には大 きな影響を与えないことから理解できる。

次に300分からの冷却・昇温について考察する。冷却 に伴って熱容量と長周期は減少し,積分強度は増加して いる。二次結晶化過程では新たな結晶が生成する。この ことで積分強度の増加は説明される。ここで生成する s 結晶が、p結晶のような広く連続した板状結晶であるか 否かは明らかではないが, p結晶の折りたたみ面が互い に直接に接して成長することはないことから, s 結晶も p 結晶との間にはアモルファスを挟んで成長すると考え られる。このため、s 結晶の生成はアモルファス層を分 割することになり、長周期の減少も説明される。一般に 高分子結晶の熱容量は,融点に近づくに従って,分子の 非線形振動, 分子軸方向のスライディング運動などによ り増加する。PEO 結晶では、この過剰熱容量は約45 ℃ より高温で無視できない大きさになる。<sup>2)</sup>アニール温度 からの冷却過程では,通常の熱振動による熱容量が減少 すると共に、過剰熱容量も減少することになる。一方, 過剰熱容量が存在する温度域で二次結晶化が起こると, 試料の熱容量を増加させる方向に働く。300分からの冷 却過程では、これらの逆方向の影響を持つ現象が同時に 起こるが、Fig.2(b)で熱容量が減少していることから、 温度低下に伴う熱容量の減少の方が支配的であること が分かる。

冷却後の昇温過程では、熱容量、長周期、積分強度は 全て冷却前の値に戻る方向に変化している。ただし、温 度は約325分で収束しているが、Fig.2(f)から分かる通り、 熱容量はいったん冷却前の値より大きくなり,その後冷 却前の曲線の延長上に収束している。最大値の317分以 後に対するフィッティングでは,緩和時間は約20分で ある。積分強度は,熱容量ほど明瞭ではないが,裾を引 いて冷却前のグラフの延長上に収束している。熱容量と 同じ時間域でフィッティングすると,緩和時間は約20 分で,熱容量とよく一致している。従って,熱容量と積 分強度の緩和は,共通の原因によって起こっていると考 えられる。長周期は Fig.2(g)で,317分から400分の間 は負の値が多い傾向があるが,裾を引いているか否かは ノイズのために明確な判断はできない。

冷却過程の考察で、二次結晶化が起こっていることは 確認できた。昇温過程では、冷却過程で生成したs結晶 が融解すると考えられる。その場合, アニール初期と同 じことが起こったとすると、アニール温度に戻った後も s 結晶がしばらく融解を続け、その間は熱容量と積分強 度の減少が起こるはずであるが,実験結果はこの考え方 が正しいことを示している。このことから, 300 分間の アニール後の冷却過程で生じた二次結晶化の s 結晶も, 溶融状態からの急冷で生じた s 結晶と同様に,融解速度 が遅いことが明らかになった。アニール初期の結果と異 なり、300分からの冷却・昇温の結果では、熱容量だけ でなく,積分強度の減少にも s 結晶の融解の効果が明瞭 に現れた。アニール初期に積分強度の増加の原因となっ た p 結晶の厚化は、150 分以後では飽和していると考え られる。従って、昇温中およびその後に更に厚化するこ とはない。そのために, Fig.2(h)では s 結晶の融解による 強度減少がはっきりと観測されたと理解できる。

以上のように、s 結晶の融解は、その生成が溶融状態 からの急冷による場合でも、長時間アニール後の急冷に よる場合でも、完了までに時間がかかることが明らかに なった。s 結晶の生成・融解は p 結晶の間で起こる。従 って、s 結晶を形成していた分子は、溶融状態でも強い 拘束条件のもとにある。そのことが融解速度にどのよう な影響を与えるかは明らかではないが、遅い融解の原因 であり得ると考えている。

本研究では、熱容量とX線回折の同時測定により、信 頼性の高い比較が可能となった。特にアニール時間300 分からの冷却・昇温後の、熱容量と積分強度の緩和につ いて、詳細な比較を行うことができた。その結果、s結 晶の融解が5Kmin<sup>-1</sup>の昇温には追いつかず、その後の 擬等温アニールにおいても緩和時間で20分という遅い 融解をしていることが明らかになった。また、熱容量測 定に、DSCではなくacカロリメトリーを用いたことに より、擬等温測定が可能になったことも、本研究の大き な特徴である。

本研究の一部は、学術研究助成基金助成金 (24540434) の援助により実施した。また、放射光実験は、高輝度光 科学研究センター (JASRI)の承認を得て、SPring-8 の BL40B2 ビームラインで実施した (2011A1398, 2012A1313, 2012B1260)。

#### 文 献

- G. R. Strobl, "The Physics of Polymers", Springer (1997) 4.2, 4.3.
- N. Koyabu, H. Yao, and Y. Saruyama, *Netsu Sokutei* W39, 20-22 (2012).
- 3) Y. Takahasi and H. Tadokoro, *Macromolecules* 6, 672 (1973).
- 4) Y. Saruyama, Polymer 24, 135-140 (1983).